

102

MEDIÇÃO REMOTA DAS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DE DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES. *Pablo R. Darde, Cléo P. Lisboa, Daniel C. Gomes, Silvio L. S. Cunha, Jorge A. Lisboa, Michel Betz* (Centro de Referência no Ensino de Física, Instituto de Física, UFRGS).

Neste trabalho desenvolvemos uma interface microprocessada para a realização de experimentos didáticos em dispositivos semicondutores, como diodos ou LEDs. Esta interface conecta-se através de uma porta RS232 a um servidor WEB, que possibilita ao usuário através de um navegador conectado em qualquer ponto da Internet, o controle do experimento, a aquisição de dados e a visualização destes resultados por meio de applets Java. A montagem experimental permitirá medir simultaneamente a curva IxV de vários diodos ou LEDs e monitorar a emissão de luz no caso dos LEDs. Com essas medidas pode-se estudar algumas das características elétricas e ópticas, bem como estimar alguns parâmetros característicos destes dispositivos. (CAPES/UFRGS).